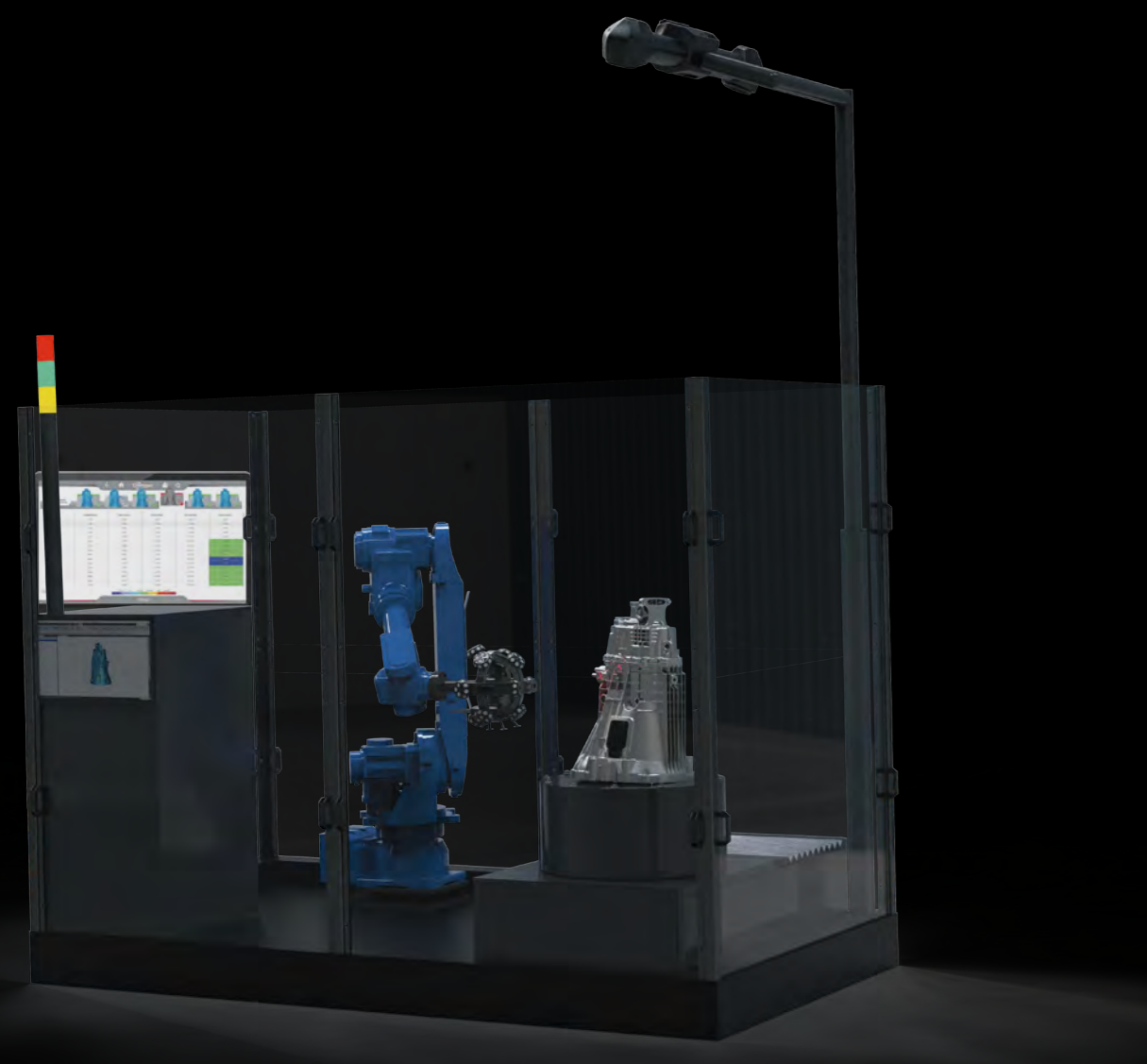


AUTOSCAN-T 自動化3D檢測系統

智慧自動 批量檢測



技術規格

型號	TrackScan-P30	TrackScan-P42	
掃描模式	高速掃描	22條交叉藍色雷射線	34條交叉藍色雷射線
	精細掃描		7條平行藍色雷射線
	深孔掃描		額外1條藍色雷射線
鐳射線數合計	30 條	42 條	
精度	0.025 mm		
最高掃描速率	1,200,000 次測量/秒	1,900,000 次測量/秒	
掃描面幅	500 mm × 600 mm		
鐳射類別	CLASS II (人眼安全)		
最小解析度	0.020 mm		
體積精度 <small>(單體積使用精掃模式)</small>	10.4 m ³	0.064 mm	
	18 m ³	0.078 mm	
體積精度 <small>(配合MSCAN-L15全域攝影測量系統)</small>	0.044 mm + 0.015 mm/m		
T-Probe 光筆	是否選配	選配	
	單點重複性	0.03 mm	
掃描物體尺寸範圍 <small>(建議)</small>	200 ~ 6000 mm		
基準距	300 mm		
景深	400 mm		
輸出格式	.stl, .ply, .obj, .igs, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等 ·可定制		
工作溫度	-10°C ~ 40°C		
介面方式	USB 3.0		
專利技術	CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1, EP3392831A4		

SCANTECH™

TRACKSCAN 追蹤式3D掃描系統

智能追蹤 極速測量



SolidWizard
實威國際

台北 TEL: 886-2-2795-1618
新竹 TEL: 886-3-657-7388
台中 TEL: 886-4-2475-8008
台南 TEL: 886-6-384-0678

高雄 TEL: 886-7-537-1919
天津 TEL: 86-22-5856-2126
蘇州 TEL: 86-512-6878-6078
上海 TEL: 86-21-6326-3589

台灣總代理

www.swtc.com

寧波 TEL: 86-574-2791-0688
廈門 TEL: 86-592-221-3168
東莞 TEL: 86-769-2202-6658

台灣總代理

SolidWizard
實威國際

測量範圍自由擴展



動態參考

TRACKSCAN

TrackScan-P 系列追蹤式 3D 掃描系統，採用智慧光學追蹤測量技術，配備高品質光學設備，無需貼點即可完成超高精度動態 3D 測量，可應用於品質控制、產品開發、逆向工程等多個方面。基於不同的掃描場景需求，TrackScan-P 系列可自由切換多種工作模式。34 束交叉藍色鐳射超快掃描，高效靈活；7 束平行藍色鐳射精細掃描，極致細節；單束藍色鐳射掃描，迅速獲取深孔及死角位置 3D 資料。

TrackScan-P 系列可搭配可攜式 CMM 測量光筆 T-Probe，可精準獲取零件縫隙、孔位、凹槽等複雜處的高精密點雲資料。還可以提供開發介面，與機器人協同工作，實現智慧線上批量自動化 3D 檢測。



超強適應力 環境感知度

輕鬆獲取光亮、黑色材質物體 3D 資料；不易受環境、震動、溫度等外界因素影響。



複合定位 精準捕捉

支援光學追蹤和標記點追蹤兩種模式，可根據現場工作情況靈活切換。



防塵防霧標記點

34束藍色交叉鐳射線 1,900,000 次測量/秒

7束平行藍色鐳射精細掃描

航空級碳纖維結構 堅固耐用

人體工學 無線便攜

單點重複性 0.030mm

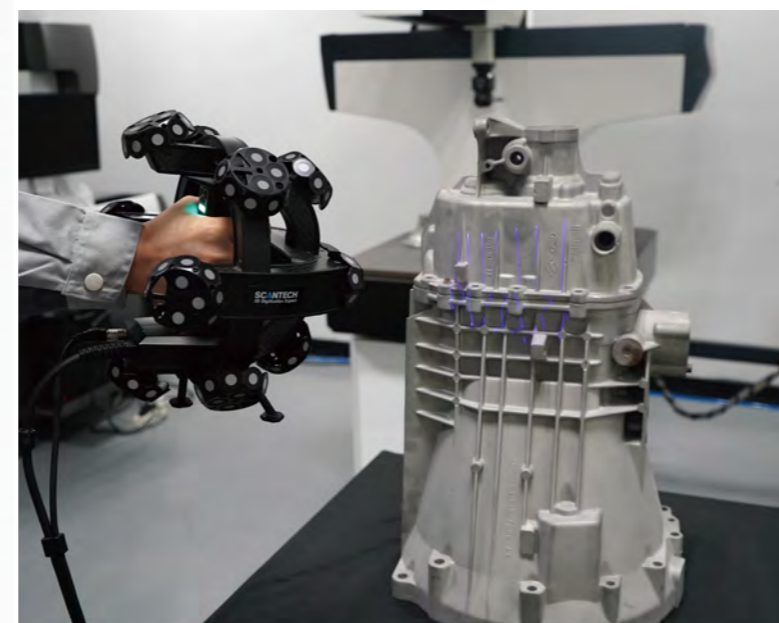


無需貼點 智能追蹤

基於智慧光學追蹤測量技術，TrackScan-P 系列追蹤式 3D 掃描系統無需貼點，即刻掃描，大幅提升工作效率、降低人力、物力成本。

極速測量 無懼細節

34 束交叉藍色鐳射超快掃描，掃描速度 1,900,000 次測量/秒；7 束平行藍色鐳射精細掃描，極致細節；單束藍色激光掃描，迅速獲取深孔及死角位置 3D 資料。



無線光筆 測量不局限

可攜式 CMM 測量光筆 T-Probe，單點重複性 0.030 mm，用於獲取基準孔、隱藏點等關鍵部位。



測量範圍自由擴展

透過調整 E-Track 光學追蹤器的位置，可對測量範圍自由靈活地擴展，且始終保持穩定的高精度。